

НАНОМЕТРОЛОГИЯ

- С. Ю. Золотаревский, С. А. Кононогов, В. Г. Лысенко, Н. А. Табачникова, Г. Г. Левин.** Методология характеристики рельефа 3D-поверхности по ее профильным и топографическим параметрам в нанометровом диапазоне 4
- С. А. Кононогов, С. Ю. Золотаревский, Ф. В. Булыгин, В. Н. Крутиков, В. Л. Лясковский.** Ареальные методы анализа топографии и текстуры поверхности в микро- и нанометровом диапазонах 13
- В. Н. Крутиков, С. Ю. Золотаревский, В. Г. Лысенко, В. Л. Лясковский.** Топологические параметры текстуры функциональных поверхностей 25
- С. Ю. Золотаревский, Д. А. Новиков, А. С. Гусев, В. Л. Лясковский.** Фрактальные методы характеристики топографии и текстуры поверхности 33
- С. Ю. Золотаревский, В. Г. Лысенко, Н. А. Табачникова, Ф. В. Булыгин, А. С. Гусев, В. Л. Лясковский.** Специфика измерительных задач при анализе рельефа поверхностей в нанометровом диапазоне линейно-угловых размеров 41